



JIMA 2016（第8回総合検査機器展）出展のお知らせ

会 期：2016年9月28日(水)～30日(金) 10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

出展場所：東5ホール No. J-59

U R L：<http://www.jima-show.jp/>



※上記 URL より来場事前登録[無料]をすることができます

CEATEC JAPAN 2016 出展のお知らせ

会 期：2016年10月4日(火)～7日(金) 10:00～17:00

会 場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

出展場所：ホール2 社会エリア No. 2S73

U R L：<http://www.ceatec.com/ja/>



※上記 URL より入場事前登録[無料]をすることができます

世界最高水準の「微粒子可視化システム」を出展します



微粒子可視化システムによる撮影事例動画が当社ホームページに掲載されています

当社の微粒子可視化システムは、超高感度カメラと独自開発の可視化光源を組み合わせた、80ナノメートルの浮遊微粒子をリアルタイムに映像化できる世界最高水準の可視化装置です。

国内外にて、システムの販売や、システムを利用した受託サービス（製造ライン中の微粒子（異物、ゴミ）や気流の調査、製造装置の内部や周辺のクリーン度評価、各種設備性能の評価など）を展開中です。

本展では、機材や各種ソフトウェア、撮影事例動画を展示し、実際に微粒子の可視化をご体感頂けるようにデモコーナーを設置します。また、販売開始直後から大変好評で、多くの業界より問合せを頂いているまったく新しいタイプの表面観察用ツール「Dライト」も展示します。この機会に是非会場でご覧ください。

<本件に関する問い合わせ先>

ビジュアルソリューション事業部 Tel: 03-3639-2206 E-mail: viest@snk.co.jp

～ 詳しくはホームページをご覧ください <http://www.snk.co.jp/particle> ～